



中华人民共和国国家标准

GB/T 15167—94

半导体激光光源总规范

General specification for light
source of semiconductor lasers

1994-08-15 发布

1995-03-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

1	主题内容与适用范围	(1)
2	引用标准	(1)
3	术语、符号、代号	(2)
4	产品分类	(2)
5	技术要求	(2)
6	试验方法	(5)
7	检验规则	(6)
8	标志、包装、运输、贮存.....	(9)
9	其他	(11)

中华人民共和国国家标准

半导体激光光源总规范

GB/T 15167—94

General specification for light
source of semiconductor lasers

1 主题内容与适用范围

本规范规定了各类半导体激光光源(以下简称产品)的通用要求。产品的特性和有关详细要求在具体型号产品的详细规范中规定。

本规范适用于由激光二极管管芯、监视光敏二极管管芯、热传感器(需要时)、致冷器(需要时)封装于同一外壳内并与尾纤(需要时)耦合成一体的半导体激光光源(简称模块),也适用于由激光二极管(带或不带尾纤)构成的激光光源(简称二极管光源)。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B:高温试验方法
- GB 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db:交变湿热试验方法
- GB 2423.6 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Eb:碰撞试验方法
- GB 2423.10 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Fc:振动(正弦)试验方法
- GB 2423.15 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ga:恒加速度试验方法
- GB 2423.22 电工电子产品基本环境试验规程 试验 N:温度变化试验方法
- GB 2423.23 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Q:密封
- GB 2423.28 电工电子产品基本环境试验规程 试验 T:锡焊试验方法
- GB 2423.29 电工电子产品基本环境试验规程 试验 U:引出端及整体安装件强度
- GB 2424.16 电工电子产品基本环境试验规程 密封试验导则
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB 6663 直热式负温度系数 热敏电阻器总规范
- GB 7247 激光产品的辐射安全、设备分类、要求和用户指南
- GB 7408 星期编号
- SJ 2214.3 半导体光敏二极管暗电流的测试方法
- SJ 2214.5 半导体光敏二极管结电容的测试方法
- SJ 2214.9 半导体光敏二、三极管脉冲上升、下降时间的测试方法
- SJ 2214.10 半导体光敏二、三极管光电流的测试方法
- SJ 2749 半导体激光二极管测试方法
- SJ 2750 半导体激光二极管外形尺寸

国家技术监督局1994-08-15批准

1995-03-01实施